

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02939131 **Image available**

COMPLEMENTARY ANALOG SWITCH

PUB. NO.: **01-236731** [JP 1236731 A]

PUBLISHED: September 21, 1989 (19890921)

INVENTOR(s): KAWADA SHIGERU

APPLICANT(s): NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP
(Japan)

APPL. NO.: 63-063856 [JP 8863856]

FILED: March 16, 1988 (19880316)

INTL CLASS: [4] H03K-017/08; H03K-017/60; H01L-027/08

JAPIO CLASS: 42.4 (ELECTRONICS -- Basic Circuits); 42.2 (ELECTRONICS --
Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,
MOS)

JOURNAL: Section: E, Section No. 861, Vol. 13, No. 568, Pg. 77,
December 15, 1989 (19891215)

ABSTRACT

PURPOSE: To prevent the malfunction by providing a protecting device including a switch element which is inserted between a signal line connecting two complementary transistor TR gates and a specific potential supply terminal and is controlled to be made conductive for nonconduction of gates.

CONSTITUTION: If a positive excessive input signal is applied to a terminal 10 when CMOS gates 150 and 160 are turned off and the circuit between an analog signal input/output terminal 10 and a common terminal 1 is in the non-connection state, source electrodes 112 and 121 of FET switches 110 and 120 are pulled to a high positive potential together. The PN junction of the switch 110 is forward bias and a partial current flows to a supply voltage terminal VDD by a large positive signal. The absolute value of the voltage between the gate and the source exceeds a threshold voltage by the

large positive signal to the source electrode 112 and the switch 110 is made conductive, and a current path is formed between the source electrode 112 and a drain electrode 113. However the potential of a terminal 102 does not rise because an FET 130 goes to the conductive state and is connected to an earth terminal, and FETs 150 and 160 are turned off as they are, and the excessive input signal does not reach the terminal 1.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平1-236731

⑬ Int. Cl. ⁴	識別記号	庁内整理番号	⑭ 公開 平成1年(1989)9月21日
H 03 K 17/08		C-8124-5J	
17/60		G-8124-5J	
// H 01 L 27/08	3 2 1	L-7735-5F	審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

⑮ 発明の名称 相補型アナログスイッチ

⑯ 特 願 昭63-63856

⑰ 出 願 昭63(1988)3月16日

⑱ 発 明 者 川 田 茂 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内
⑲ 出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号
⑳ 代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 書

1. 発明の名称

相補型アナログスイッチ

2. 特許請求の範囲

少なくとも1つのアナログ信号端子と他のアナログ信号端子との間に挿入された相補トランジスタ・ゲートを備えてなる相補型アナログスイッチにおいて、前記相補トランジスタ・ゲートと直列に挿入された他の相補トランジスタ・ゲートと、前記二つの相補トランジスタ・ゲートの間を結ぶ信号線と特定電位供給端子間に挿入され、前記二つの相補トランジスタ・ゲートの導通・非導通を制御する制御信号によって前記相補トランジスタ・ゲートの非導通時に導通となるよう制御されるスイッチ素子とを含む保護装置を有することを特徴とする相補型アナログスイッチ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は相補型アナログスイッチに関し、特に、モノリシック集積回路上に形成されるCMOSアナログスイッチに関する。

(従来の技術)

従来、モノリシック集積回路上に形成されるアナログ信号入力マルチプレクサに使用されるスイッチ回路は、アナログ信号入力の入力電圧範囲を広くとれる様にCMOS構造を用い、例えば第4図に示すように、各アナログ信号入出力端子10、20、…、N0にそれぞれ接続され、デコーダ回路2からの制御信号180、280、…、n80がゲートに印加されたpMOSFETスイッチ150、250、…、n50と、制御信号180、280、…、n80がそれぞれ入力されたインバータ170、270、…、n70の出力である制御信号190、290、…、n90がゲートに印加されたnMOSFETスイッチ160、260、…、n60とを用いて構成されており、通常静電気に対する保護のため、各入力端子にダイオードと抵

抗による保護装置等（図示しない）がつけられていた。

第5図は第4図に示した従来のマルチプレクサにおけるスイッチを集積回路上に実現した場合の一例を示した模式図である。

p型の集積回路基板3上に設けられたロウウェル151にpMOS FETスイッチ150が形成され、また基板3上にnMOS FETスイッチ160が形成されている。

ここで制御信号180が高レベルとなり、pMOS FETスイッチ150、nMOS FET 160がオフし、アナログ信号入出力端子10と共通端子1との間が非接続状態になり、制御信号280が低レベルとなり、pMOS FETスイッチ250、nMOS FET 260がオンし、アナログ信号入力端子20と共通端子1との間が接続状態となっている場合に、アナログ信号入力端子10に負の過大入力信号が雑音等として印加されたとする。pMOS FETスイッチ150においてはソース電極152に負の過大入力信号が印加さ

れ、この場合はゲート電極155は高レベルとなっているためpMOS FETスイッチ150はオンしないが、一方nMOS FETスイッチ160においては、ソース電極161に負の過大入力信号が印加されるとp型基板3と順方向接合が形成され印加された負信号により一部の電流はp型基板接地点4から電流が流れる。またゲート電極163は低レベルつまりほぼ接地電位にありnMOS FETスイッチ160のゲート・ソース間電圧 V_{gs} がしきい電圧 V_{th} より小さかったためオフしていたのが、ソース電極161が負の電位となるために、ゲート電位がほぼ接地電位にもかかわらず V_{gs} が V_{th} より大きくなって、nMOS FETスイッチ160がオンしてしまいこの負の過大入力信号が共通端子1へ到達してしまい共通端子1の電位に悪影響を与えてしまう。一方アナログ信号入力端子10に正の過大入力信号が印加された場合は、上述とは全く逆にpMOS FETスイッチ150がオンしてしまい同様に共通端子1に悪影響を与えてしまっていた。

〔発明が解決しようとする課題〕

上述した従来のCMOSアナログスイッチは、アナログ信号入出力端子と共通端子という2つのアナログ信号端子の間にCMOSゲートが挿入されているだけであるので、アナログ信号入出力端子に加わる過大電圧により誤動作する場合が生じるといふ欠点があった。

本発明の目的は、過大電圧による誤動作を防止する保護装置を備えた相補型アナログスイッチを提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

本発明の相補型アナログスイッチは、少なくとも1つのアナログ信号端子と他のアナログ信号端子との間にそれぞれ挿入された相補トランジスタ・ゲートを備えてなる相補型アナログスイッチにおいて、前記相補トランジスタ・ゲートと直列に挿入された他の相補トランジスタ・ゲートと、前記二つの相補トランジスタ・ゲートの間を結ぶ信号線と特定電位供給端子間に挿入され前記二つの相補トランジスタ・ゲートの導通・非導通を制御

する制御信号によって前記相補トランジスタ・ゲートの非導通時に導通となるよう制御されるスイッチ素子とを含む保護装置を有するというものである。

〔実施例〕

次に本発明について図面を参照して説明する。

第1図は本発明の第1の実施例の回路図である。

アナログ信号入出力端子10、20…は本発明の保護装置100、200、…の第1の端子101、201、…に接続され、保護されるMOS FETスイッチ(150、160)、(250、260)、…はそれぞれソース電極同士およびドレイン電極同士に共通に接続されてCMOSゲートを構成し、その共通ソース電極が保護装置100、200、…の第2の端子102、202、…に接続されている。保護されるスイッチのうちpMOS FETスイッチ150、250、…のゲート電極はそれぞれ制御信号線180、280…に接続され、nMOS FETスイッチ160、260、…のゲート電極は、それぞれ制御信号線180、280、

…の反転信号を作るインバータ170, 270, …を介して、制御信号^線190, 290, …が接続されている。保護装置100, 200, …を構成しているpMOS FETスイッチ110, 210, …のゲート電極は制御信号線180, 280, …に接続されており、nMOS FETスイッチ120, 220, …のゲート電極には制御信号線190, 290, …に接続されており、これらpMOS FETスイッチ110, 210, …のソース電極は、n型MOS FETスイッチ120, 220, …のソース電極にそれぞれ接続され保護装置100, 200, …の第1の端子101, 201, …に接続されている。またpMOS FETスイッチ110, 210, …のドレイン電極は、nMOS FETスイッチ120, 220, …のドレイン電極にそれぞれ接続され保護装置100, 200, …の第2の端子102, 202, …に接続されている。また保護装置100, 200, …の第3のMOS FETスイッチであるnMOS FETスイッチ(スイッチ素子)130, 230, …は保護

装置100, 200, …の第2の端子102, 202, …と接地電位との間に接続されゲート電極は制御信号線180, 280, …に接続されている。また保護されるMOS FETスイッチ対(CMOSゲート)(150, 160), (250; 260) …の共通電極は互いに接続され、共通端子1(他のアナログ信号端子)に接続されている。

ここでCMOSゲート(150, 160), と(110, 120)は同時にオン/オフし、nMOS FETスイッチ130はCMOSゲート(110, 120)と逆相でオン/オフする。したがってCMOSゲート(150, 160)と(110, 120)がオフしている時には保護装置の第2の端子102はMOS FETスイッチ130がオンし低インピーダンスで接地されている。一方CMOSゲート(150, 160)と(110, 120)がオンしている時はnMOS FETスイッチ130はオフし、アナログ信号入出力端子10と共通端子1とが接続状態となっている。

第2図は保護装置を集積回路で実現した場合の

一例を示す模式図である。

今CMOSゲート(150, 160)がオフし、アナログ信号入出力端子10と共通端子1間が非接続状態にある時に、アナログ信号入出力端子10に正の過大入力信号が印加されたとする。pMOS FETスイッチ110のソース電極112とnMOS FETスイッチ120のソース電極121は共に大きな正電位へ引かれ、pMOS FETスイッチ110のnウェル111とソース電極112との間のPN接合は順方向バイアスとなり、印加された大きな正信号により一部の電流はウェル接続点114より電源電圧端子VDDへ流れる。また、pMOS FET 110はゲート電極が端子103を介して電源電位にバイアスされ本来オフしているが、ソース電極112への大きな正信号によりゲートソース間電圧V_{gs}の絶対値が閾値電圧V_{th}よりも大きくなり導通し、ドレイン電極113との間に電流経路が形成される。一方nMOS FETスイッチ120においてはpMOS FETスイッチ110とは導電型が異なるため一

切不具合は生じない。しかしここでMOS FETスイッチ対(110, 120)の接続されている第2の端子102は、nMOS FETスイッチ130が導通状態となり接地端子に接続されているため、電位が上昇せず、MOS FETスイッチ対(150, 160)はオフしたままとなり、この正の過大入力信号は共通端子1へ到達する事はなくなる。

一方アナログ入出力端子10に負の過大入力信号が印加された場合は、上述の説明とは逆にpMOS FETスイッチ110は一切不具合を生じないが、nMOS FETスイッチ120においてソース電極121と基板3との間で順方向バイアスとなり、一部電流が基板接続点4より流れ、またnMOS FETスイッチ120が導通し、ソース電極121とドレイン電極122との間に電流経路が形成される。しかしnMOS FETスイッチ130により第2の端子102は低インピーダンスで接地されているため、MOS FETスイッチ対(150, 160)はオフしたままとなり、この負の過大入力信号は共通端子1へ到達することはない。

くなる。

ここで第2の端子102の電位は入力された過大入力信号をMOS FETスイッチ110又は120のオン抵抗とMOS FETスイッチ130のオン抵抗とで分圧したものとなるため、過大入力信号の電位の絶対値を V_{IN} 、p MOS FETスイッチ110がオンした時のオン抵抗を R_{110} 、n MOS FETスイッチ120がオンした時のオン抵抗を R_{120} 、またn MOS FETスイッチ130のオン抵抗を R_{130} とすると、第2の端子102の電位 V_{102} は、

正の過大入力信号の場合、

$$V_{102} = V_{IN} \times R_{130} / (R_{110} + R_{130})$$

負の過大入力信号の場合、

$$V_{102} = -V_{IN} \times R_{130} / (R_{120} + R_{130})$$

となる。

従って、過大入力信号が印加された場合、それが正の過大入力信号あるいは負の過大入力信号のいずれであるにせよ、第2の端子102の電位 V_{102} が上述のように定まるのでn MOS FET

られるので負の過大入力信号に対する保護効果大きい。

以上、相補トランジスタ・ゲートがCMOS構成の場合について説明したが、横型バイポーラ・トランジスタを使用してもよいことは改めて詳述するまでもなく明らかである。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明は相補型アナログスイッチにおいて、もう一つの相補トランジスタ・ゲートを挿入し、電源端子又は接地端子に他端が接続されたスイッチ素子を1個付加することにより、入出力端子（アナログ信号端子）に印加された正または負の過大入力信号が誤って他のアナログ信号端子へ伝達されることはなくなり、相補型アナログスイッチの誤動作を防止できる効果がある。

特にアナログスイッチの他端側にサンプル・ホールド回路が接続されている場合には、アナログスイッチが非導通のホールド状態において、入出力回路に過大入力信号が印加されてもホールド値

スイッチ130のオン抵抗が小さいと全く問題がない。

この第1の実施例では負の過大入力信号の場合より、正の過大入力信号の場合の方がMOS FETスイッチ150または160のゲートソース間電圧 V_{GS} を小さくおさえられるので正の過大入力信号に対する保護効果は大きい。

第3図は本発明の第2の実施例の回路図である。第1図に示した第1の実施例とほぼ同様な構成であるが、各保護装置100、200、…の第2の端子102、202…に接続されていたスイッチ素子が第1の実施例ではn MOS FETスイッチで接地端子との間を導通させていたが、本実施例ではp MOS FETスイッチ140、240、…を介して電源端子 V_{DD} に接続されている。

このように構成をすると、第1の実施例に準じた動作をするが、ただしこの場合は第1の実施例とは反対に正の過大入力信号の場合より負の過大入力信号の方がMOS FETスイッチ150または160のゲートソース間電圧 V_{GS} が小さくおさえ

が乱されない。

また、いくつかのアナログスイッチの一端が共通に接続されマルチプレクサを構成している場合も、選択されていない入出力端子に過大入力信号が印加されても選択されているスイッチへの影響は全くない。

以上説明した通り、特にサンプル・ホールド回路と組合わせて使用されるアナログスイッチ回路、あるいはマルチプレクサ回路と組合わせて使用されるアナログスイッチ回路として過大入力時の誤差発生を防止する大きな効果を示すものである。

尚入出力端子から保護装置に至る経路に電流制限抵抗を接続する等の公知の静電保護等と組合わせて使用してもよいことは当然である。

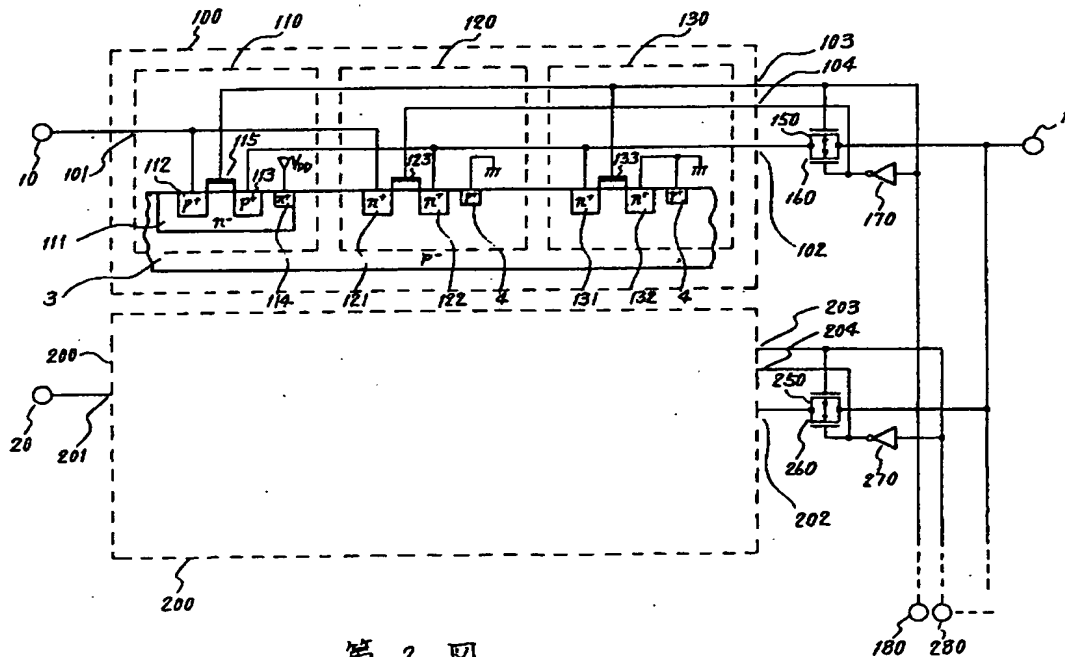
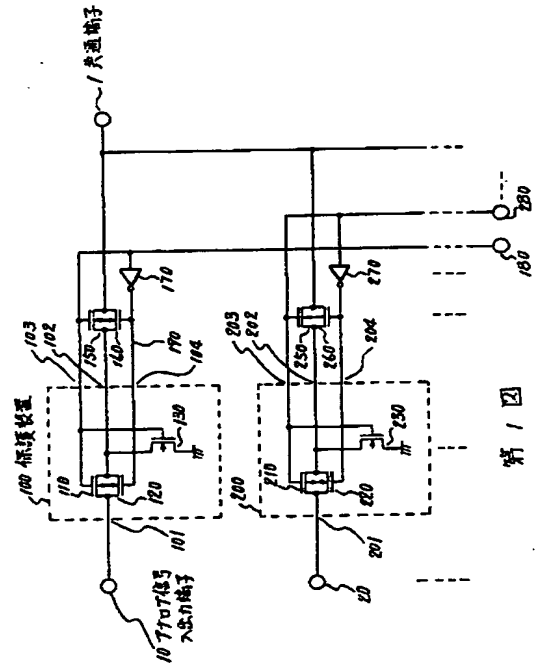
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例の回路図、第2図は第1の実施例をチップレベルで説明するための模式図、第3図は本発明の第2の実施例の回路図、第4図は従来例の回路図、第5図は従来例を

チップレベルで説明するための模式図である。

1 ……共通端子、2 ……デコーダ、3 ……乗算回路基板、4 ……基板接地点、10、20、…、
n0 ……入出力端子、100、200、…保護装置、
101、201 ……第1の端子、102、202 ……
第2の端子、103、104、203、204 ……端
子、110、140、150、210、240、250、
…n50 ……pMOS FETスイッチ、120、
130、160、220、230、260、…n60 …
…n MOS FET スイッチ、170、270、…n
70 ……インバータ、180、190、280、290、
…n80、n90 ……制御信号又は制御信号線、
111、151 ……nウェル、112、113、121、
122、131、132、152、153、161、
162 ……ソース又はドレイン電極、115、
123、133、155、163 ……ゲート電極。

代理人 弁理士 内 原 哲



第 2 図

